蒸着イソプロピルベンゼンガラスの in situ DTA 測定:構造緩和に伴う熱的変化

(学習院大・理) O早川翼、中尾輝、仲山英之、石井菊次郎

In situ DTA measurement of vapor-deposited isopropylbenzene glasses: Thermal changes accompanying structural relaxation (Department of Chemistry, Gakushuin University) OTsubasa Hayakawa, Akira Nakao, Hideyuki Nakayama, Kikujiro Ishii

【序論】蒸着分子性ガラスは、蒸着温度 Taに より密度の異なる試料が生成し、昇温時の挙動 もしばしば異なる(図 1)[1]。Taがガラス転 移温度 Tgよりも十分低い場合は低密度のガラ スが生じ、構造緩和時にそれらの体積は減少す る。一方、アルキルベンゼンガラスでは、Td が Tgに近い場合は高密度のガラスが生じ、構 造緩和時にそれらの体積は増加する。これらの 構造緩和に伴う熱的変化を調べるために、私た ちは DTA シグナルと体積を同時測定できる装 置を作成し、すでにエチルベンゼン (EB) を 試料とした測定結果を報告した。その結果、高 密度ガラスは、体積膨張を伴う構造緩和におい て吸熱を示した。この結果は、断熱熱量計によ る測定とほぼ一致した[2]。一方、低密度ガラ スでは、DTA 出力に体積収縮に伴う異常な変 化が観測されたが、その原因についてはまだわ かっていない。今回、同様の測定をイソプロピ ルベンゼン (IPB) で行った。

【実験】高真空装置内(約 10<sup>-7</sup> Pa)に取り付けた DTA ユニットの模式図を図 2 に示す。

DTA ユニットは銅ブロックから出来ており、 基板には 0.1 mm 厚のコンスタンタン板を用 いている。これに2本のクロメル線を溶接し、 クロメルーコンスタンタン熱電対として使用 し、DTA センサーとした。基板温度は、DTA ユニットに差し込んだクロメルーアルメル熱 電対を用いて測定した。試料は基板の半分を覆 ったマスクによって、基板の片側にしか蒸着し ない。蒸着後、DTA ユニット全体を一定速度 (0.94 K/min) で昇温し、試料を蒸着した面 と蒸着していない面の温度差を熱起電力とし て測定した。また同時に、マスク面に蒸着した 試料にレーザー光を入射し、反射光の光干渉に よる強度変化から試料の膜厚を推定した。また、 この反射光強度の変化により昇温時の試料の 状態変化をモニターした。

【結果】図3に、高密度蒸着IPB 試料(Ta=120 K、膜厚17µm)の昇温過程における熱起電力 と反射光強度のガラス転移前後の変化を示す。 反射光強度の変化から、蒸着試料はガラス状態



昇温に伴うモル体積の変化.



図 2. DTA ユニットの模式図.



図3. 高密度 IPB 蒸着試料の熱起電力と反 射光強度(フォトダイオードの出力) の変化(T<sub>d</sub>=120 K, 膜厚 17 μm).

から過冷却液体になり、その後結晶化したこと がわかった[1]。ガラス転移直前(約 138 K) の反射光強度の急激な変化は、急激な体積膨張 を示している。この変化に伴い熱起電力には鋭 い吸熱ピークが観測された。また、過冷却液体 状態で一時的に反射光強度の減少が見られた。 これは液体構造の不均一による光散乱のため であると考えられる。

図4に、低密度蒸着 IPB 試料(Ta=80 K、 膜厚 17 μm)の昇温過程における熱起電力と 反射光強度のガラス転移前後の変化を示す。こ の低密度蒸着試料も、ガラス状態から過冷却液 体になり、その後結晶化した。また、過冷却液 体状態で一時的に反射光強度の減少が見られ た。この時、高密度試料とは異なり、熱起電力 に明瞭な発熱ピークが観測された。これは以前 EB で観測されたものと同様の、液体 - 液体緩 和による発熱であると考えられる[1,3]。また、 体積収縮時(116 K から 135 K)に熱電対起電 力のカーブに、なだらかなくぼみが観測された (図4の赤矢印)。

図5は、ガラス転移点直前で観測された高密 度ガラス(Ta=120K)の吸熱ピーク(青)と 低密度ガラス(Ta=80K)の熱電対起電力のカ ーブのくぼみ(赤)の面積を膜厚に対してプロ ットした結果である。高密度ガラスの吸熱ピー クは膜厚に比例し、その傾きを融解ピークと比 較することで見積もった吸熱量は1.0 kJ/mol であった。この値はEBの高密度ガラスについ



図 4. 低密度 IPB 蒸着試料の熱起電力と反 射光強度(フォトダイオードの出力) の変化(*T*a=80 K, 膜厚 17 µm).

て断熱熱量計を用いた測定で観測されている 値と比較して妥当な大きさである[2]。このこ とから IPB の高密度ガラスは EB と同様、エ ンタルピー的にも通常の液体急冷ガラスより 安定であると考えられる。一方、低密度ガラス で観測された熱起電力のくぼみは膜厚と相関 がなく、本質的な量が観測されていない。また、 吸熱と考えるには値が大きすぎ、断熱熱量計に よる測定結果とも対応していない。そのため、 低密度ガラスの緩和に伴う熱的変化について はさらなる検証が必要である。



図 5. 構造緩和時の吸熱ピーク面積 の膜厚依存性.

- K. Ishii et al., Chem. Soc. Jpn. 82 (2009) 1240.
- [2] L. M. Ramos et al., J. Phys. Chem. B, 115 (2011) 14327.
- [3] K. Ishii et al., Chem. Lett. **39** (2010) 958.